



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

EDITAL N.º 017

SELEÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METROLOGIA E QUALIDADE

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL

INMETRO - 2025

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - Inmetro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio André Oliveira Brito, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, nomeado pelo Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, em Portaria de 07 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 08 de março de 2023, torna público o presente Edital, que divulga as condições de inscrição e de acesso ao Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade, no ano de 2025.

1. DO OBJETIVO DO CURSO

1.1. O curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade objetiva a capacitação de recursos humanos, dotando-os de conhecimentos e competências tecnológicas, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam às demandas do mercado de trabalho em Metrologia, Qualidade, Regulação e Avaliação da Conformidade.

2. DO PÚBLICO ALVO

2.1. Portadores de diploma de graduação em qualquer área de conhecimento de qualquer nacionalidade.

3. DAS VAGAS

3.1. Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas para ingresso no primeiro trimestre de 2025.

3.2. Os candidatos serão submetidos a processo seletivo único.

3.3. As vagas para o Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade serão preenchidas por ordem de classificação dos aprovados no processo seletivo.

3.4. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecidas.

4. DAS ÁREAS DO CURSO

4.1. As linhas de pesquisa e lista de sugestão de temas de estudo e pesquisa podem ser consultadas no sítio do Inmetro: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade>

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. O prazo para inscrição será de **09 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025**.

5.2. Todas as informações referentes às inscrições e resultados poderão ser obtidas no sítio do Inmetro: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade>

5.3. A documentação descrita no item 6 para a realização da inscrição deve ser encaminhada da seguinte forma:

a) pelo candidato, através do Balcão Digital (Portal de Serviços), no endereço <https://www.gov.br/pt-br/servicos/candidatar-se-ao-processo-seletivo-para-a-pos-graduacao-em-metrologia-e-qualidade-mestrado-profissional>.

5.4. A ausência de qualquer dos documentos solicitados, o envio em outro formato ou documentos não nomeados corretamente acarretará na exclusão do candidato do processo.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

6.1. Para que a inscrição no processo seletivo seja confirmada e aceita, é necessário o envio dentro do prazo de inscrição descrito no item 5.1, dos seguintes documentos (ANEXO I):

a) **Formulário de Inscrição** no Processo Seletivo, disponível no sítio do Inmetro, devidamente preenchido;

b) **Currículo Lattes** atualizado até 2 (dois) meses antes da publicação desse Edital, cadastrado na Plataforma Lattes (<http://lattes.cnpq.br/>). O currículo Lattes deverá ser gerado em uma via, na versão resumida, selecionando todos os itens, padrão de referência ABNT, sem indexador, com todo o período de atuação profissional e de produção acadêmica;

c) **Carta de Apresentação** assinada pelo candidato justificando seu interesse pelo curso, mencionando o objeto de estudo, temas de interesse e a interação com suas atividades profissionais. A Carta deverá indicar a disponibilidade de tempo para realização do curso e se há interesse do candidato por bolsa de estudo;

d) **2 (Duas) Cartas de Recomendação**, de redação livre, redigidas e assinadas por professores ou profissionais da área de interesse do candidato, preferencialmente Mestres ou Doutores, com identificação do correio eletrônico para confirmação de seus conteúdos, quando necessário;

e) **Proposta de projeto de pesquisa (OPCIONAL)** elaborada de acordo com o modelo do ANEXO II. O Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade disponibilizará aos candidatos a lista de temas de pesquisa e respectivos docentes responsáveis no sítio do Inmetro (<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade>). Outros temas poderão ser propostos pelo candidato desde que estejam alinhados com a área de concentração e com as linhas de pesquisa do PPGMQ;

f) **Formulário de Termo de Compromisso do Empregador**, disponível no sítio do Inmetro, formalizando a liberação do candidato para realizar o curso, caso o candidato possua vínculo empregatício;

g) **Carta de ciência do orientador - professor credenciado (OPCIONAL)**, disponível no sítio do Inmetro, atestando que está ciente de sua indicação como provável orientador. A aprovação do nome do orientador está vinculada à aprovação do candidato no Processo Seletivo e da disponibilidade de vagas do professor orientador para novos alunos;

h) Cópia legível do **Histórico Escolar** do curso de Graduação.

6.2. Os candidatos aprovados e classificados para cursar o Mestrado deverão apresentar o **Diploma de Graduação** (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso superior, em papel timbrado, devidamente carimbado e assinado pelo dirigente da instituição emissora, no ato da matrícula.

6.3. A não apresentação da documentação completa no ato da inscrição, **exceto a documentação considerada opcional**, implicará na desclassificação definitiva do candidato.

7. DA SELEÇÃO

7.1. O processo seletivo será conduzido pela Comissão Permanente de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade e constará de 4 (quatro) etapas.

7.2. As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do ANEXO III deste Edital e serão divulgadas no sítio do Inmetro (<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/pos-metrologia-e-qualidade>).

7.3. Primeira Etapa: Análise da Documentação

7.3.1. Serão considerados aptos, nesta **Primeira Etapa**, aqueles candidatos que enviarem toda a documentação elencada no item 6 (exceto a documentação considerada **opcional**) até o fim do prazo de inscrição. A ausência de qualquer documento exigido implicará na eliminação do candidato.

7.3.2. Os candidatos considerados aptos nesta etapa terão seus nomes publicados no sítio do Inmetro que consta no item 5 deste Edital.

7.4. Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos de Metrologia e Qualidade

7.4.1. A prova de conhecimentos específicos terá caráter eliminatório, com pontuação que varia de 0 (zero) a 10 (dez), sendo exigida nota mínima 7 (sete) para aprovação. O nome e nota de todos os candidatos serão publicados no sítio do Inmetro, com a indicação daqueles que foram aprovados e reprovados.

7.4.2. A sistemática de realização da prova de conhecimentos específicos consiste em:

a) Que os candidatos tenham acesso a 3 (três) artigos científicos em língua inglesa com diferentes temas em Metrologia e Qualidade, fornecidos pela Secretaria Acadêmica a partir do momento da sua inscrição;

b) Na aplicação de uma prova contendo questões discursivas sobre os artigos disponibilizados.

7.4.3. A Secretaria Acadêmica enviará os 3 (três) artigos científicos aos candidatos por meio de correio eletrônico (e-mail), após a sua inscrição. Os artigos científicos poderão ser gravados em *pen drive* pela Secretaria, a pedido do candidato, desde que o candidato forneça a mídia a ser utilizada.

7.4.4. Na avaliação da prova escrita, a Comissão Permanente de Seleção observará:

a) Conhecimento teórico e capacidade de análise de resultados científicos;

b) Capacidade de contextualização teórica e metodológica;

c) Capacidade de expressão escrita, incluindo ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão conceitual e gramatical e clareza.

7.4.5. A prova será realizada remotamente, através de link que será disponibilizado por correio eletrônico (e-mail), na data indicada no Calendário de Atividades, apresentado no ANEXO III deste Edital.

7.4.6. O número de candidatos selecionados para a Terceira Etapa não poderá exceder o total de 40 (quarenta), respeitada a ordem de classificação obtida.

7.5. Terceira Etapa: Arguição do Candidato

7.5.1. Os candidatos aprovados na Segunda Etapa do processo seletivo participarão da Terceira Etapa, que será composta pela Arguição do Candidato.

7.5.2. A Arguição do Candidato receberá pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), com exigência de nota mínima 7 (sete) para aprovação.

7.5.3. A atribuição de pontuação relativa à arguição considerará sua capacidade de expressão na apresentação de sua experiência profissional e acadêmica, bem como avaliará a motivação e empenho do candidato em cursar o Mestrado, especialmente se suas intenções estão alinhadas com o objetivo do Programa; a disponibilidade do candidato para se dedicar às atividades

acadêmicas e de desenvolvimento da dissertação; se os objetivos do candidato estão relacionados com as linhas de pesquisa do programa; bem como sua clareza na exposição de ideias, postura e comunicação verbal apropriadas.

7.5.4. A Arguição do Candidato será individual, agendada pela Secretaria Acadêmica por meio de envio de correspondência eletrônica (e-mail). Os candidatos realizarão suas apresentações remotamente, através de software de conferência como *Skype*, *Google Meet* ou semelhante, respeitando agendamento prévio da Secretaria.

7.5.5. Cada candidato terá o tempo de até 5 (cinco) minutos para fazer a apresentação de sua experiência profissional e acadêmica, sem o uso de qualquer recurso multimídia.

7.5.6. A Banca Examinadora deverá ser composta por no mínimo 2 (dois) doutores, sendo pelo menos um obrigatoriamente docente permanente do Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade e terá até 20 (vinte) minutos para arguir o candidato.

7.5.7. Ficam impedidos de participar da Banca Examinadora: parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, bem como cônjuge ou companheiro do candidato.

7.6. **Quarta Etapa: Análise Curricular**

7.6.1. A Quarta etapa é composta de análise curricular dos candidatos classificados na terceira etapa.

7.6.2. A análise curricular será feita com base no Currículo *Lattes* do candidato e documentos comprobatórios, sendo considerado para análise os últimos 5 (cinco) anos da produção.

7.6.3. Itens não listados no Currículo *Lattes* do candidato ou sem documentos comprobatórios não serão considerados na avaliação.

7.6.4. A análise curricular atribuirá pontuação conforme a tabela constante no ANEXO IV.

7.6.5. A análise curricular atribuirá pontuação máxima de 10 (dez) pontos.

7.6.6. A Quarta Etapa tem caráter classificatório.

7.7. **Classificação**

7.7.1. Serão classificados os candidatos aprovados, conforme a soma das pontuações obtidas na Segunda, Terceira e Quarta Etapas do processo seletivo. Em caso de empate será dada preferência àquele que tiver obtido a maior nota na Terceira Etapa do processo. Persistindo o empate, será dada preferência ao candidato de maior idade.

8. **DA MATRÍCULA**

8.1. Os candidatos classificados que não se matricularem no prazo definido pelo Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade perderão o direito à vaga, sendo convocados novos candidatos entre os aprovados obedecendo à ordem de classificação.

9. **DO CALENDÁRIO**

9.1. Os candidatos deverão observar as datas e prazos estipulados no Calendário de Atividades constante no ANEXO III, parte integrante deste Edital.

10. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1. O Curso será realizado nas dependências do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Campus de Inovação e Metrologia, localizado na Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Xerém - Duque de Caxias - RJ.

10.2. O curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses. As aulas serão ministradas duas vezes por semana, às segundas e terças-feiras, em horário integral.

10.3. Ao aluno que concluir com sucesso o curso será concedido o título de Mestre em Metrologia e Qualidade.

10.4. O curso no Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade é gratuito.

10.5. Todas as etapas do processo seletivo admitem a interposição de recursos dentro do prazo constante no Calendário de Atividades, apresentado no ANEXO III deste Edital, exclusivamente através do endereço eletrônico mestradoprofissional@inmetro.gov.br.

10.6. A seleção dos candidatos, realizada por força deste Edital, somente terá validade para o presente processo seletivo.

10.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade do Inmetro.

11. **DA PUBLICAÇÃO**

11.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial da União (DOU).



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM 05/12/2024, ÀS 11:41, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO
Presidente

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1973995 e o código CRC 56C85AEF.



ANEXO I

MESTRADO PROFISSIONAL EM METROLOGIA E QUALIDADE PROCESSO SELETIVO 2025 DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO		
ITEM	DOCUMENTO	
01	Formulário de inscrição	
02	Currículo <i>Lattes</i>	
03	Carta de Apresentação	
04	02 (duas) Cartas de Recomendação	
05	Proposta de projeto de pesquisa (opcional)	
06	Formulário de Termo de Compromisso do Empregador	
07	Carta de ciência do orientador (opcional)	
08	Cópia legível do Histórico Escolar	

ANEXO II

Modelo de Proposta de Projeto de Pesquisa

Nome do candidato: _____

Título do Projeto (centralizado, em caixa alta e negrito)
Resumo descritivo do tema (até 200 palavras)
1. Introdução 2. Objetivos 3. Metodologia 4. Resultados esperados 5. Considerações sobre o potencial e impacto da proposta
Justificativa sobre a escolha do tema, caracterização do problema a ser pesquisado, método de coleta e análise dos dados e indicadores que mostrem o impacto (social, econômico, etc.) do projeto na área de Metrologia e/ou Qualidade.
Cronograma de trabalho

ANEXO III

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

<i>Etapas</i>	<i>Períodos</i>
Inscrição	09/12/2024 a 17/01/2025
<i>1ª Etapa</i>	<i>1ª Etapa</i>
Resultado da análise da documentação	21/01/2025
Recurso	22/01/2025
Resultado do Recurso	23/01/2025
<i>2ª Etapa</i>	<i>2ª Etapa</i>
Prova de Conhecimentos Específicos	27/01/2025 9 h 00 min às 12 h 00 min
Resultado	30/01/2025
Recurso	31/01/2025
Resultado do Recurso	03/02/2025

3ª Etapa	3ª Etapa
Arguição do candidato	04/02/2025 a 07/02/2025 <i>(conforme agendamento prévio da secretaria)</i>
Resultado	10/02/2025
Recurso	11/02/2025
Resultado do Recurso	12/02/2025
4ª Etapa	4ª Etapa
Resultado	14/02/2025
Recurso	17/02/2025
Resultado do Recurso	18/02/2025
Resultado Final	19/02/2025
Período de Matrícula	24/02/2025 a 26/02/2025
Homologação da Matrícula	27/02/2025
Início das aulas	10/03/2025

ANEXO IV

Tabela 1. Pontuação a ser atribuída durante a etapa de análise curricular dos candidatos.

Itens a serem pontuados	Pontuação
Formação Acadêmica	máximo 2,00 pontos
Iniciação Científica (IC) e/ou Tecnológica (IT), período mínimo de 1 ano	0,50 pontos
Pós-graduação Lato Sensu completa	0,50 pontos
Mestrado completo	1,00 ponto
Doutorado completo	2,00 pontos
Produção Acadêmica (últimos 5 anos)	máximo 6,00 pontos
Artigos publicados em periódicos científicos indexados	2,00 pontos ^[1]
Patentes depositadas	2,00 pontos ^[1]
Livro publicado com ISBN	2,00 pontos ^[1]
Artigos ou resumos publicados em Anais de Congressos	1,00 ponto ^[1]
Capítulo de livro com ISBN	1,00 ponto ^[1]
Experiência Profissional	máximo 2,00 pontos
Experiência profissional relacionada à área de concentração do PPGMQ (Tecnologia Industrial Básica). A experiência pode ser comprovada por contrato de trabalho, empresa pública ou privada, bolsa de pesquisa, profissional liberal ou sócio de empresa com atividade no CNAE	0,10 ponto ^[2]
Vínculo societário ou profissional com empresa de tecnologia ou integrantes de <i>startups</i>	0,10 ponto ^[2]
TOTAL DE PONTOS (máximo)	10,00 pontos

[1] Por cada artigo/patente/livro/capítulo/resumo publicado ou aceito para publicação.

[2] Por ciclo completo de 1 (um) ano.

ANEXO V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sistema de Internacional de Medição, Vocabulário Internacional de Metrologia, Incerteza de Medição, Validação de Métodos de Medição, Materiais de Referência, Metrologia Legal, Tecnologia Industrial Básica, Avaliação da Conformidade, Acreditação.

BIBLIOGRAFIA

COSTA-FÉLIX, R.P.B.; BERNARDES, A T (Org.). Metrologia Vol. 1: Fundamentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2017. v. 1. 320 p.

Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2018-2022. Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2017. 71 p.

INMETRO. Vocabulário internacional de termos de metrologia legal. 4. ed. Rio de Janeiro, INMETRO, 2005. 22p.

Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012. 94 p.

ARTIGOS

1. NAKUTIS, Z. et al. **A framework for remote in-service metrological surveillance of energy meters.** Measurement, v. 168, p. 108438, jan. 2021.
2. KHATTAR, R. B.; NEHME, M. E. **Emergence and evolution of standardization systems in medical biology laboratories.** Advances in laboratory medicine, v. 0, n. 0, 1 maio 2024.
3. KRAJCSÁK, Z. **Implementing Open Innovation Using Quality Management Systems: The Role of Organizational Commitment and Customer Loyalty.** Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, v. 5, n. 4, p. 90, 30 out. 2019.